

<<SOC测试>>

图书基本信息

书名：<<SOC测试>>

13位ISBN编号：9787560539751

10位ISBN编号：7560539750

出版时间：2012-1

出版时间：西安交通大学出版社

作者：雷绍充

页数：257

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<SOC测试>>

内容概要

本书系统化介绍SOC测试方法与结构，主要内容包括SOC测试的原理和标准，扫描测试与内建自测试，软件自测试，测试压缩，低功耗测试，延迟测试，模拟与混合电路测试，RF电路测试，SOC与NOC测试。

本书既可作为高等院校电子与信息、计算机科学与技术 and 电气工程类高年级学生和研究生专业课教材，也可作为从事集成电路设计、制造、测试、应用、EDA和ATE专业人员的参考用书。

<<SOC测试>>

书籍目录

第1章 简介

1.1 SOC测试的重要性

1.2 SOC测试一些标准

1.2.1 边界扫描(IEEE1149.1)

1.2.2 IEEE 1149.6

1.2.3 模拟与混合信号电路边界扫描标准IEEE 1149.4

1.2.4 IEEE 11500

1.2.5 IEEE 11687

参考文献

第2章 扫描测试与内建自测试

2.1 基本的扫描设计结构

2.1.1 基于多路选择器—D触发器的扫描设计

2.1.2 带时钟的扫描设计

2.1.3 电子敏感扫描设计

2.1.4 增强的扫描设计

2.2 低功耗扫描设计结构

2.2.1 多相或多序低功耗扫描设计

2.2.2 通带宽度匹配的低功耗扫描设计

2.3 实速扫描设计

2.4 逻辑内建自测试

2.4.1 测试图形生成电路

2.4.2 测试响应压缩

2.4.3 逻辑内建自测试结构

2.4.4 低功耗BIST结构

2.5 实速逻辑BIST了

2.5.1 单捕获

.....

第3章 SOC测试与NOC测试

第4章 测试压缩

第5章 延迟测试

第6章 低功耗测试

第7章 模拟与混合信号测试

第8章 射频电路测试

第9章 基本软件的自测试

附录

<<SOC测试>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>